



جهاز ميكروسكوب القوة الذرية Atomic Force microscopy (AFM)

يتكون **AFM** من ذراع **cantilever** في نهايته مجس **probe** مكون من رأس حاد يعرف بالـ **tip** يستخدم لمسح سطح العينة. تكون الذراع مصنوعة من مادة السليكون أو نيتريد السيليكون بنصف قطر في حدود بضعة نانومترات. عندما يقترب رأس المجس من سطح العينة تتولد قوة بين رأس المجس وسطح العينة تؤدي هذه القوة إلى انحراف الذراع بناءً على قوة هوك وهذا حسب نوع السطح الذي يتم دراسته. يتم إسقاط شعاع ليزري على الذراع **cantilever** والذي يرتفع وينخفض مع ارتفاع وانخفاض الأبرة وبالتالي مع تنوع تضاريس السطح من ارتفاع وانخفاض، ويتم التقاط منعكس شعاع الليزر على الحامل على مستقبل وبالتالي يتم تحديد ورسم تضاريس السطح الممسوح تبعاً لحركة منعكس شعاع الليزر.

فكرة عمل جهاز :

يستخدم مجهر القوة الذرية في معرفة تضاريس السطوح ذات الأبعاد النانوية وحتى الميكرونية

تطبيقات الجهاز :

مجس **probe** مكون من رأس حاد يعرف بالـ **tip**
مصدر شعاع ليزر
كاشف

مكونات ووصف الجهاز:

